# 平成28年度 宇宙科学に関する室内実験シンポジウム

微小デブリ衝突による衛星電力ハーネスの電気的損傷リスク

Risk of electric failure on satellite's power harnesses caused by space debris impacts

平井 隆之<sup>1</sup>, 東出 真澄<sup>1</sup>, 黒崎 裕久<sup>1</sup>, 川北 史朗<sup>1</sup>, 長谷川 直<sup>1</sup>, 万戸 雄輝<sup>2</sup>, 山口 翔太<sup>3</sup>, 田中 孝治<sup>1</sup>

Takayuki Hirai<sup>1</sup>, Masumi Higashide<sup>1</sup>, Hirohisa Kurosaki<sup>1</sup>, Shirou Kawakita<sup>1</sup>, Sunao Hasegawa

Yuki Mando<sup>2</sup>, Shota Yamaguchi<sup>3</sup>, Koji Tanaka<sup>1</sup>

1宇宙航空研究開発機構,2徳島大学,3東海大学

<sup>1</sup>Japan Aerospace Exploration Agency, <sup>2</sup>University of Tokushima, <sup>3</sup>Tokai University

### 1. はじめに

運用終了後に軌道上に廃棄された人工衛 星やロケット上段,衛星表面材料に由来す る破片等はスペースデブリ(以下,デブリ) と呼ばれる.デブリは低軌道衛星に対して は平均 10 km/s という超高速で衝突するた め,人類の持続的宇宙開発利用において喫 緊の課題となっている.デブリ衝突による 衛星システムの損傷は,破砕といった機械 的損傷だけでなく,衝突誘起放電による電 源系コンポーネントの機能低下・喪失とい った電気的損傷がある.特に電力ハーネス の電気的損傷は,比較的衝突頻度の高い直 径 1 mm 以下の微小デブリの衝突によって も発生しうることが示唆されている<sup>[1]</sup>.

宇宙航空研究開発機構(以下, JAXA) では、衛星の損傷リスク評価をまとめたス ペースデブリ防護設計マニュアルを発行し ている.衛星ミッションの信頼性を確保す るためには、マニュアルに最新の設計情報 を反映することが重要である.そこで本研 究では、最新の衛星設計に基づいた電力ハ ーネスの電気的損傷リスクを実際の衝突環 境に近い状態で評価する.また、致命的な 持続放電に至るメカニズムを解明し、衛星 電源系における安全設計の提案を目指して いる.本稿では、今年度実施したハーネス 単線およびハーネス束に対する衝突実験の 結果について報告する.

# 2. 実験方法

微小デブリ衝突を模擬するため,JAXA 宇宙科学研究所の二段式軽ガス銃を用いた.

図1に衝突実験に用いた2種類のハーネ ス供試体を示す.供試体には、衛星の電力 ハーネスとして汎用される TE connectivity の SPEC 55 ワイヤ (AWG22) を用いた.ハ ーネス単線供試体は, ワイヤを折り返し作 成した幅約6 cm のハーネス面を, 厚さ3 mm の A2024 板上に固定した.一方,ハーネス 束供試体は,回路のホットラインとリター ンラインを交互に重ねた三層構造を,単線 供試体と同様 A2024 板に固定している.図 2 に回路構成を示す. なお, 今回報告する ハーネス束の実験では、衛星内部機器を模 擬した負荷抵抗を用いていないため, 衝突 によりハーネス間の短絡やアルミ板との地 絡がない限り,回路は開放した状態である. 衛星電源の模擬には太陽電池シミュレータ を用いた. 電源電圧は低軌道衛星で一般的 な 50 V,および静止軌道衛星で一般的な 100 V とした. 電源電流は 2~3 A が流れる よう負荷抵抗を調整し、抵抗と並列に1mF のコンデンサバンクを接続した. 放電の有 無と持続時間を計測するため, 電圧プロー ブと電流プローブを用いた. 電圧プローブ で電源電圧(Vsrc)を測定し、電流プローブ は電源電流(Isrc)とアルミ板への地絡電流 (Ignd) を測定する.





図 1 ハーネス単線供試体(左)とハーネス束供試体(右). ハーネス束供試体については A2024 板に最も近い一層分のみ示している.



図2 ハーネス供試体の回路構成.ハーネス単線負荷抵抗なし(左),ハーネス単線負荷抵抗 あり(中央),ハーネス東負荷抵抗なし(右).

本研究では衝突時に発生するプラズマの 密度を推定するため、ダブルプローブ法を 用いたプラズマ電流計測も実施した.図3 にプローブ回路図を示す.5つのダブルプ ローブを使用し、衝突点から1~5 cmの距 離に1 cm おきに配置した.ハーネス面とプ ローブ電極端の間は約1 cm 空けている.各 プローブには9.6 Vの電圧を印可し、検出 抵抗は衝突点から1 cmのプローブは1.5 k  $\Omega$ ,それ以外の4つのプローブには10 k $\Omega$ を使用した.プローブ電極の詳細について は長岡の文献<sup>[2]</sup>を参照されたい.図4 にハ ーネス供試体とダブルプローブを設置した 状態を示す.

飛翔体は直径 0.3 mm, 0.5 mm, 1.2 mm

のステンレス球(以下, SUS 球),および酸 化アルミニウム球(以下,アルミナ球)を 使用した.散弾撃ち,単発撃ちの両方で射 出し,ハーネス供試体に 4~7 km/sの速度で 衝突させた.

#### 実験結果と考察

表1と表2に実験結果を示す. 放電継続 時間が>500 ms となっているショットで持 続放電が発生し, ハーネスには炭化溶融し た痕が確認され, 地絡または短絡故障に至 っていた. なお161121-1 は放電継続時間が >170 ms となっているが, これはオシロス コープの測定レンジを超えスケールアウト





図3 プラズマプローブ回路.

図4 ハーネス供試体とダブルプローブの配置.

ショット	粒子材	粒子径	衝突	衝突速度	電源条件	負荷抵抗	放電継続時間
番号	料	(mm)	数	(km/s)		有無	(ms)
160628-1	$Al_2O_3$	1.2	1	6.94	50 V/2 A	有	0.1
160630-3	$Al_2O_3$	0.5	1	6.70	50 V/2 A	有	1
160630-4	$Al_2O_3$	0.3	1	6.89	50 V/2 A	有	3.6
160810-1	$Al_2O_3$	0.5	3	6.91	100 V/2 A	有	41
160810-2	$Al_2O_3$	0.5	2	6.87	100 V/2 A	無	16
160810-3	$Al_2O_3$	0.5	6	4.03	100 V/2 A	無	26
160810-4	$Al_2O_3$	0.5	3	3.99	100 V/2 A	無	0
160810-5	$Al_2O_3$	0.5	5	4.03	100 V/2 A	無	28
160811-1	$Al_2O_3$	0.5	1	7.01	50 V/2 A	有	22
160811-3	$Al_2O_3$	0.5	1	6.98	50 V/2 A	有	13
161122-3	SUS304	0.3	3	6.87	100 V/3 A	無	50
161122-4	SUS304	0.3	3	3.86	100 V/3 A	無	>500
161124-2	SUS304	0.3	1	3.83	50 V/2 A	無	8.5
161124-5	$Al_2O_3$	0.3	1	7.06	100 V/3 A	無	>500

表1 ハーネス単線供試体の実験結果.

表2 ハーネス東供試体の実験結果.プロジェクタイルはすべて SUS 球で負荷抵抗は使用していない.

ショット	粒子径	衝突数	衝突速度	電源条件	放電継続時間
番号	(mm)		(km/s)		(ms)
161121-1	0.5	1	6.94	100 V/3 A	>170
161121-2	0.3	5	3.85	100 V/3 A	>500
161122-1	0.3	6	4.09	50 V/2 A	0.1

したためであり,炭化溶融及び地絡短絡故 障も確認されず,持続放電は発生していない.

まずハーネス単線について電源条件に 注目すると、電圧・電流が100 V/3 A で持 続放電が発生している(ショット番号: 161122-4,161124-5).一方で、100 V/3 A で あっても持続放電に至っていない161122-3 は、持続放電が発生した161122-4と実験条 件を比較すると衝突速度が1.8 倍程度速い こと以外は同一である.つまり、衝突強度 がより低い方が持続放電を起こしていると いえる.161124-5 は、同一直径において SUS 球の4 km/s 衝突と同等の損傷をもたらすこ とを想定しアルミナ球を7 km/s で衝突させ、 持続放電が発生している.次にハーネス束



図5 衝突痕の顕微鏡画像.ショット番号 161122-3 (7 km/s)(左), 161122-4 (4 km/s)(右). 161122-4 については持続放電が発生しなかった衝突痕を観察した.



図 6 ダブルプローブで取得したプラズマ電流波形.ショット番号 161122-3 (7 km/s)(左), 161122-4 (4 km/s)(右). プローブは衝突予測点から 1, 2, 3, 4, 5 cm の距離に設置し, 1 cm のプローブがいずれのショットで最も大きいプラズマ電流値を示している.

について,161121-1 と 161121-2 を比較する と,衝突強度が低い 161121-2 の方で持続放 電が発生している.なお,プロジェクタイ ルの衝突数については後述するが,トリガ ー放電には寄与するが持続放電の有無には 影響しないと考えられる.

以上のことから,持続放電に至るには3 A 程度の電源電流と,ある程度低い衝突強 度が必要であることが示唆される.これら の条件について放電のメカニズムから考察 する.まず電流については,電流密度が高 いほど陰極における熱電子放出が活発にな り,維持電圧の低いアーク放電に至り放電 が継続する.したがって100 V/2 A では次 に衝突強度については,損傷領域が拡大す ると,電極間(単線供試体ではワイヤ芯線 とアルミ板,東供試体ではホットおよびリ ターンのワイヤ芯線)の距離が大きくなり, 放電を持続しづらくなると考えられる.図 5に上で比較した 161122-3 と 161122-4 の衝 突痕の顕微鏡画像を示す.約7km/sで衝突 している161122-3では、ワイヤ芯線が完全 に破断しアルミ板とは距離が開いているよ うに見える.一方で約4km/sで衝突した 161122-4では、一部の芯線が変形しアルミ 板に付着しているように見え、放電の経路 はより短いことがわかる.つまり衝突強度 については、ハーネスワイヤの芯線を露出 する程度に高く、電極間距離を比較的短く 保つ程度に低いことが、持続放電の条件と いえる.

なお、衝突数については持続放電の有無 には影響しないと考えられる. 複数衝突の ショットでは、そのうちの一つの衝突痕で のみ持続放電、炭化溶融が起きている. こ れはある一つの衝突痕でのみ回路が閉じ、 電源から供給されるエネルギーが消費され るためと考えられる. 衝突数が多いほどプ ラズマの密度は高くなるが、ダブルプロー ブ計測から衝突誘起プラズマは 0.5 ms 以内 には衝突痕近傍から十分拡散することがわ かっている.図6にプラズマ計測波形の例 を示す.そのためプラズマ密度は放電の開 始にのみ影響すると考えられる.ただしハ ーネス単線の供試体ついては、一本のワイ ヤを折り返してハーネス面を構成している ため、仮に持続放電に至るような損傷を伴 う衝突痕があっても、回路上流側で断線が 発生し電流が流れないという状況が想定さ れる.これを防ぐには、散弾ではなく単発 でプロジェクタイルを射出する必要がある だろう.

電源条件が 50 V/2 A, 100 V/2 A で, ア ルミナ球,0.5 mmのショットに注目すると, 放電継続時間と各種条件の間に相関は見ら れない.上述のように放電の継続にはハー ネスの損傷度合いが影響すると考えられる ため,同じ実験条件であっても,ワイヤ中 央に衝突したか線間に衝突したかなどによ って放電継続時間は変わりうると考えられ る.

全く放電を検知できなかった 160810-4 は、衝突した3つのプロジェクタイルすべ てがハーネスワイヤの中央部に衝突し、衝 突痕部分前面の被覆は吹き飛び、芯線は露 出しているものの、アルミ板との間に放電 経路は形成されなかったと考えられる.こ の放電が検知されなかったショットについ ても、損傷状態と放電の関係を裏付けてい ると考えられる.

# 4. まとめ

本稿では、微小デブリ衝突による衛星電 カハーネスの電気的損傷について、より実 際の設計・環境に近い状況でのリスク評価 と,持続放電に至るメカニズムの解明を目 的に,二段式軽ガス銃を用いた超高速衝突 実験を実施した.実験から、地絡・短絡と いった致命的故障に至る持続放電には、約 3 A 以上の高い電源電流と、放電経路とな る電極間の距離を短く保つ適度な衝突強度 が必要なことが示唆された. 今後は単発衝 突を中心に、電源電圧およびプラズマ密度 とトリガー放電の関係や、持続放電を引き 起こす条件を明らかにし、来年度中にスペ ースデブリ防護設計マニュアル改訂のため の衝突実験データの取得を完了する予定で ある.

## 謝辞

本研究は、宇宙航空研究開発機構宇宙科学 研究所超高速衝突実験共同利用施設の採択 課題として実施しました.

# 参考文献

[1] 宇宙航空研究開発機構, JERG-2-144-HB001A スペースデブリ防護 設計マニュアル, 2014.

[2] 長岡洋一,宇宙機の薄型パネル構造への 超高速衝突における電気的現象の研究,総 合研究大学院大学博士論文,2012.